PAT-NO:

JP361238981A

DOCUMENT-IDENTIFIER:

JP 61238981 A

TITLE:

METHOD FOR MAKING UNIFORM HIGH-FREQUENCY ETCHING

PUBN-DATE:

October 24, 1986

INVENTOR-INFORMATION:

NAME

KIKUCHI, MASASHI

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

ULVAC CORP

N/A

APPL-NO:

JP60079251

APPL-DATE:

April 16, 1985

INT-CL (IPC): C23F001/00, H01L021/302

US-CL-CURRENT: 216/63

ABSTRACT:

PURPOSE: To easily and uniformly etch the entire part of a substrate by providing a perforated flat plate in front of an anode and adjusting the distance from said plate and anode in such a manner as to be larger at the point where the rate of etching is low and to be smaller at the point where the rate thereof is high.

CONSTITUTION: The perforated flat plate 6 having the same potential as the potential of the flat plate-shaped anode 2 is placed in front of the anode 2 apart at a spacing therefrom in the stage of introducing gas such as CHF<SB>3</SB> under adequate low pressure into a vacuum chamber 1, providing the anode 2 and cathode 3 in parallel with each other, throwing electric power from a high-frequency power source 4 thereto and etching the substrate 5 provided to the cathode 3. The flat plate 6 disposed with the hole parts 6a in a zigzag shape, etc., is adjusted by a suitable means such as, for example, curving either the anode 2 or the flat plate 6 in such a manner as to increase the distance between the flat plate 6 and the anode 2 at the point where the etching rate of the substrate 5 is low and to decrease the above-mentioned distance at the point where the above-mentioned rate is high. The substrate 5 is etched uniformly over the entire part by adjusting partially the rate of etching according to the above-mentioned method.

COPYRIGHT: (C) 1986, JPO&Japio

9/19/05, EAST Version: 2.0.1.4

⑩ 日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

⑫公開特許公報(A)

昭61-238981

@Int_Cl_4

識別記号

庁内整理番号

❸公開 昭和61年(1986)10月24日

C 23 F 1/00 H 01 L 21/302 6793-4K 8223-5F

審査請求 未請求 発明の数 1 (全3頁)

の発明の名称

高周波ェッチングの均一化方法

②特 顧 昭60-79251

②出 願 昭60(1985)4月16日·

砂発 明 者 菊 池

正志

藤沢市長後1831

外2名

⑪出 願 人 日本真空技術株式会社

茅ケ崎市萩園2500番地

00代 理 人 弁理士 北村 欣一

明 超 普

1. 発明の名称

高周波ェッチングの均一化方法

2. 特許請求の範囲

3. 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本発明は高周波電源に接続した電極にシリコンウェハ等の基板を取付け、これに均一にエッチングを施す方法に関する。

(従来の技術)

従来、基板に高周波電源によりエッチングす

ることは行なわれており、基板に施されるエッチングが不均一になると陽極と降極の電極関距 継を変えることも行なわれている。

(袋明が解決しようとする問題点)

電価間距離を変えてエッチングの不均一を修正すると、関節したい個所以外のエッチング速度が変えられてしまうことが多く、基板全体を均一にエッチングするための調節が容易でない。本発明はエッチングの速度を簡単に部分的に調節して基板全体の均一なエッチングを行なう方法を提供することを目的とするものである。

(問題点を解決するための手段)

本発明では、平板状の陽極と陰極を実空室内に平行して設け、陰陰極を高周波電源に接続し、陰陰極に設けた基板にエッチングを施すようにしたものに放て、陰陽極の前面に関係を子してこれと同電位の多孔平板を設け、基板のエッチング速度の低い個所の多孔平板と陽極との原となった。

-419-

した。

(作用)

(寒悠例)

. 1

本発明の実施例を図面につき説明すると、第1図に於て(1)は真空室、(2)(3)は該真空室(1)内に 耳に平行して設けた平板状の陽極と陰極で、22 陰極(3)は高周波電源(4)に接続され、陽極(2)はア

ば酸孔部(6 a) に入り込む。 酸孔部(6 a) 内に於けるグロー放電は、酸孔部(6 a) の内機間を電子が 往復するために比較的強いグローになる。

またこの孔内に入り込んだグローは、多孔平板(6)の背後の空間に何もない場合、第2図 A に示すように孔路(6 a) を通して背後へと拡がりその強度も高くなるが、背後に第2図 B に示すように関係(2)が接近して位置するとグローは孔路

(6 a) を通して拡がることがなくその強度も弱く かみ-

従つて、例えば第3図示のように関係(2)と験を(3)間に配置した基板(5)の位置 I、 I に 近けるエッチングの選皮が第4図に見られるように位置 I、 I で次第に選くなる場合、第1図示のように多孔平板(6)をエッチング速度が遅くなるのは、第5図示のように基板(5)の各位置 I、 I のエッチングを均一化出来る。

尚、第1図示のエッチング装置に 於て降板(2)と 陰極(3)の距離は15mであり、其空室(1)内には ースに接続される。(5)は陰価(3)に取付けした基板を示し、陰真空室(1)内を真空化して真周波電線(4)より電力を投入すると、陽価(2)と陰価(3)の関でグロー放電が発生し、放電領域内で生じたイオンが陰極(3)の基板(5)に突入してその表面をエッチングする。

験多孔平板(6)の詳細は第2図示の如くであり、 グロー放電(7)は例えば験多孔平板(6)の孔部(6s) の口径が陽極シースの厚味もの2倍以上であれ

ONP: のガスを Q Q 7 5 Torrの圧力に導入し、高周波電力密度が Q 2 5 W/cdとなるように電源 (4)から電力を与え、多孔平板(6)には直径 3 = の孔部(6a)を 5 == 間隔で千鳥状に配列した。 陽極(2)と多孔平板(6)はそのいずれかを第 6 図又は第 7 図示の如く 舞曲させ、また陰極(3)を回転させるように構成してもよい。

(発明の効果)

このように本発明によるときは、陽極の前面に多孔平板を設け、これと陽極との距離をエッチング速度の低い個所で大きく、速い個所では小さく関節するようにしたので簡単に基板全体を均一にエッチングするように関節出来る効果

密面の簡単な説明

第1 図は本発明の実施例の説明線図、第2 図はグロー放電状態の説明図、第5 図は一般的エンチング接世の説明線図、第4 図は第5 図のエンチング速度の線図、第5 図は第1 図示の場合のエンチング速度の線図、第6 図及び第7 図は

本発明の他の実施例の説明慕図である。

(1)… 実空室

(2) … 蜀 極

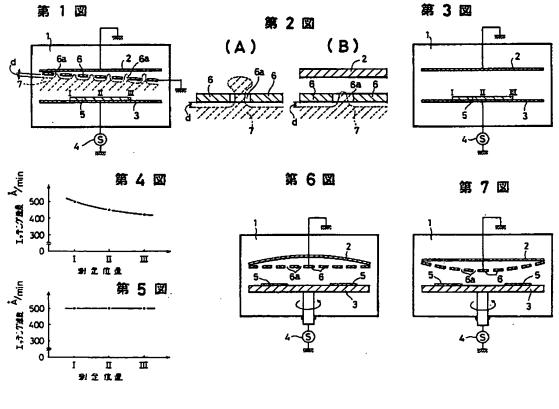
(3) … 降 無

(4)…高周波電源

(5)…盖板

(6) … 多孔平板

特 計 出 顧 人 日本真空技術株式会社 代 理 人 北 村 脉 一 外 2 名



-421-

9/19/05, EAST Version: 2.0.1.4